

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

62005-7

Première édition
First edition
2004-01

**Fiabilité des dispositifs d'interconnexion
et des composants optiques passifs
à fibres optiques –**

**Partie 7:
Modélisation de contrainte de durée de vie**

**Reliability of fibre optic interconnecting
devices and passive optical components –**

**Part 7:
Life stress modeling**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 62005-7:2004

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

62005-7

Première édition
First edition
2004-01

**Fiabilité des dispositifs d'interconnexion
et des composants optiques passifs
à fibres optiques –**

**Partie 7:
Modélisation de contrainte de durée de vie**

**Reliability of fibre optic interconnecting
devices and passive optical components –**

**Part 7:
Life stress modeling**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**FIABILITÉ DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET DES COMPOSANTS OPTIQUES PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –**

Partie 7: Modélisation de contrainte de durée de vie

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62005-7 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86B/1896/FDIS	86B/1906/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RELIABILITY OF FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE OPTICAL COMPONENTS –

Part 7: Life stress modeling

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62005-7 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86B/1896/FDIS	86B/1906/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

La CEI 62005 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Fiabilité des dispositifs d'interconnexion et des composants optiques passifs à fibres optiques*:

- Partie 1: Guide d'introduction et définitions
- Partie 2: Evaluation quantitative de la fiabilité en fonction d'essais de vieillissement accélérés – Température et humidité; régimes continus
- Partie 3: Essais significatifs pour l'évaluation des modes et mécanismes de défaillance des composants passifs
- Partie 4: Sélection des produits
- Partie 5: Essais accélérés concernant des environnements de services normalisés¹
- Partie 6: L'utilisation de données de terrain pour déterminer, spécifier et améliorer la fiabilité de composant¹
- Partie 7: Modélisation de contrainte de durée de vie
- Partie 8: Méthodes d'essais et modèles statistiques pour estimer la fiabilité: une amorce sur des principes essentiels¹
- Partie 9: Norme de qualification de fiabilité¹

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

¹ A l'étude.

IEC 62005 consists of the following parts, under the general title *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical components*

- Part 1: Introductory guide and definitions
- Part 2: Quantitative assessment of reliability based on accelerated ageing tests – Temperature and humidity; steady state
- Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive components
- Part 4: Product screening
- Part 5: Relating accelerated tests to standardized service environments¹
- Part 6: The use of field data to determine, specify and improve component reliability¹
- Part 7: Life stress modelling
- Part 8: Test methods and statistical models for estimating reliability: a primer on fundamentals¹
- Part 9: Reliability qualification standard¹

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

¹ Under consideration.

FIABILITÉ DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET DES COMPOSANTS OPTIQUES PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –

Partie 7: Modélisation de contrainte de durée de vie

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62005 décrit un ensemble commun de procédures pour l'évaluation de la fiabilité des connecteurs, des épissures, des dispositifs de branchement et autres composants passifs à fibres optiques. La présente partie traite spécifiquement de la fiabilité des composants estimée à partir d'essais de durée de vie qui sont accélérés d'une manière ou d'une autre comme dans l'exemple de la CEI 62005-2.

Dans la mesure où des systèmes de matériau différent conçus pour effectuer le même travail répondront fréquemment de façon différente aux mêmes contraintes, à la fois en termes de forme de la fonction d'accélération et de distribution statistique des temps de défaillance (ou de dégradation par rapport au temps), une norme spécifiant les méthodes particulières d'accélération ou de modélisation statistique n'est pas appropriée. A la place, la présente Partie 7 fournit les prescriptions minimales pour la présentation des données et des analyses afin d'appuyer la fiabilité estimée des composants passifs, et une partie informative (bibliographie) contenant des références à des écrits plus détaillés sur la modélisation physique et statistique au sujet des essais accélérés.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 62005-2:2001, *Fiabilité des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs à fibres optiques – Partie 2: Evaluation quantitative de la fiabilité en fonction d'essais de vieillissement accélérés – Température et humidité; régimes continus*

CEI 62005-3:2001, *Fiabilité des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs à fibres optiques – Partie 3: Essais significatifs pour l'évaluation des modes et mécanismes de défaillance des composants passifs*

3 Présentation de la preuve de fiabilité du dispositif

3.1 L'argument pour la fiabilité

L'argument pour la fiabilité doit satisfaire aux critères suivants:

- Il doit être cohérent avec la connaissance physique existante des modes de défaillances stimulée par la contrainte particulière du dispositif comme décrit dans la CEI 62005-3 et la CEI 62005-5.
- Il doit être statistiquement cohérent avec l'ensemble des données recueillies dans l'étude expérimentale du dispositif en question. Les intervalles de confiance des paramètres de prédiction doivent être cohérents avec les données et le modèle supposé. La ou les valeurs aberrantes doivent être mentionnées. L'élimination des valeurs aberrantes peut être justifiée par des arguments raisonnables basés sur une compréhension de la procédure expérimentale.

RELIABILITY OF FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE OPTICAL COMPONENTS –

Part 7: Life stress modeling

1 Scope

This part of IEC 62005 describes a common set of procedures for estimating the reliability of fibre optic connectors, splices, branching devices and other passive components. This part deals specifically with component reliability as estimated from life tests which are accelerated in some manner as in the example of IEC 62005-2.

Since different material systems designed to do the same job will often respond in very different ways to the same stresses, both in terms of the form of the acceleration function, and the statistical distribution of failure times (or degradation observed over time), a normative standard specifying specific methods of acceleration or statistical modeling is inappropriate. Instead, this Part 7 provides a minimal normative standard for presenting data and analyses to support reliability estimates of passive components and an informative portion (bibliography) containing references to more extensive writings on physical and statistical modeling for accelerated testing.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62005-2:2001, *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components – Part 2: Quantitative assessment of reliability based on accelerated ageing tests – Temperature and humidity; steady state*

IEC 62005-3:2001, *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components – Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive components*

3 Presenting evidence of device reliability

3.1 The argument for reliability

The argument for reliability shall meet the following criteria:

- It shall be consistent with existing physical knowledge of the failure modes stimulated by the device specific stress as described in IEC 62005-3 and IEC 62005-5.
- It shall be statistically consistent with all the data gathered in experimental study of the device in question. Confidence intervals on prediction parameters must be consistent with the data and the assumed model. Statistical outlier(s) shall be reported. Elimination of outliers may be justified by reasonable arguments based on an understanding of experimental procedure.

3.2 Approches de la fiabilité

Les trois approches suivantes sont des façons légitimes d'appuyer des arguments qu'un dispositif est fiable par rapport à une contrainte particulière:

3.2.1 Essais d'acceptation

Lorsque l'argument pour la fiabilité est basé sur la survie des dispositifs sans défaillance soumis à des conditions accélérées, le temps, la durée et la contrainte de l'essai d'acceptation doivent être justifiés. L'essai doit être basé sur un modèle réaliste qui montre que les conditions d'essai déterminent les mécanismes de défaillance de fonctionnement vraisemblables pendant la durée de vie du service. Les déterminations de la confiance statistique basées sur des modèles de probabilité doivent aussi être fournies.

Les éléments suivants doivent être mentionnés:

- un essai doit être décrit (par exemple 85 °C pendant 2 000 h) et les conditions de durée de vie du service équivalentes doivent être décrites (par exemple 35 °C pendant 25 ans);
- l'ensemble des processus chimiques qui font que cet essai est un essai de fin de vie (par exemple tous les processus thermiques activés avec une énergie d'activation plus grande que 0,92 eV);
- pourquoi cet ensemble de processus est supposé être raisonnable (par exemple, pour des systèmes de matériau similaire, une énergie d'activation inférieure à 1,0 eV n'est jamais observée);
- les paramètres mesurés et la procédure de mesure utilisés pour l'essai (par exemple la quantité de dégradation);
- le nombre de dispositifs en essai;
- le niveau de confiance statistique supporté par cette expérience, et l'argument pour ce niveau de confiance (par exemple, la probabilité cumulée de défaillance estimée sur 5 ans est $p = 0,010$. Les limites inférieures et supérieures de cette estimation à 90 % de confiance sont $p = 0,005$ et $p = 0,018$).

3.2.2 Modèles de défaillance et de dégradation

Lorsque l'argument pour la fiabilité est fourni par des modèles particuliers de défaillance ou de dégradation, le modèle physique doit être décrit, et des limites de confiance statistiques pour les prédictions aux conditions de fonctionnement doivent être fournies. Les procédures utilisées dans le calcul des limites statistiques doivent être décrites ou, si un logiciel informatique est utilisé dans le calcul, le programme ou son nom et sa version doivent être fournis. En particulier, ce qui suit doit être mentionné.

Les références aux études précédentes utilisées pour développer ou restreindre le modèle doivent être énumérées.

- La conception de l'expérience utilisée pour l'estimation des paramètres et pour la vérification du modèle doit être décrite.
- Les conditions de fonctionnement supposées doivent être décrites.
- Les extrapolations et les limites de confiance des ces extrapolations doivent être données, avec soit:
 - a) une description des procédures statistiques utilisées pour arriver aux limites, soit
 - b) la marque et le modèle du logiciel et la version utilisée pour l'analyse.

3.2 Approaches to reliability

The following three approaches are legitimate ways of supporting arguments that a device is reliable with respect to a specific stress:

3.2.1 Acceptance testing

When the argument for reliability is based on survival of devices without failure under accelerated conditions, the time, duration and stress of the acceptance test shall be justified. The test shall be based on a realistic model that shows that the test conditions bound plausible failure mechanisms operating during service life. Statistical confidence bounds based on probability models shall also be provided.

The following shall be reported:

- a test shall be described (e.g. 85 °C for 2 000 h) and the equivalent service life conditions shall be described (e.g. 35 °C for 25 years).
- the set of chemical processes such that this test is an end of life test (e.g. all thermally activated processes with an activation energy greater than 0,92 eV);
- why this set of processes is assumed to be reasonable (e.g., for similar material systems an activation energy below 1,0 eV has never been observed);
- the measured parameter and the measurement procedure used for testing (e.g. amount of degradation);
- the number of devices tested;
- the statistical confidence level supported by this experiment, and the argument for that confidence level (e.g. the estimated cumulative failure probability at 5 years is $p = 0,010$; the lower and upper bounds on this estimate at 90 % confidence are $p = 0,005$ and $p = 0,018$).

3.2.2 Failure or degradation models

When the argument for reliability is provided by specific models of failure or degradation, the physical model shall be described, and statistical confidence bounds for the predictions at operating conditions must be provided. The procedures used in calculating the statistical bounds shall be described or if computer software is used in the calculation, the program or its name and version shall be provided. In particular, the following shall be reported.

References to previous studies used in developing or constraining the model shall be listed.

- The experiment design used for parameter estimation and checking the model shall be described.
- The assumed operating conditions shall be described.
- The extrapolations and confidence bounds on those extrapolations shall be given, along with either:
 - a) a description of the statistical procedures used to arrive at the bounds, or
 - b) make and model of the software and version used for the analysis.

3.2.3 Qualification de fiabilité précédente

Si une qualification de fiabilité (pour la présente norme) a été réalisée précédemment pour un système de matériau similaire et qu'un rapport détaillé de la méthode est disponible, il peut être utilisé comme base soit pour un modèle de défaillance/dégradation, soit pour un essai d'acceptation.

3.2.3 Previous reliability qualification

If previous reliability qualification (to this standard) of a similar material system has been done and a detailed report of the method is available, it may be used as a basis either for a failure/degradation model or an acceptance test.

Bibliographie

Les concepts de base des méthodes d'essai et les outils d'analyse disponibles pour l'évaluation de la fiabilité des dispositifs sont répertoriés aux références [3] et [4]. Ils donnent des descriptions de la modélisation physique et statistique intégrée qui entre dans la conception et l'analyse des essais accélérés. Des informations supplémentaires sont données aux références [5] et [6] sur la conception expérimentale et l'analyse de données.

[1] CEI 62005-1: 2001, *Fiabilité des composants passifs et des dispositifs d'interconnexion à fibres optiques – Partie 1: Guide d'introduction et définitions*

[2] CEI 62005-5, ____ *Fiabilité des composants passifs et des dispositifs d'interconnexion à fibres optiques – Partie 5: Essais accélérés concernant des environnements de services normalisés*²

[3] NELSON, W. *Accelerated Testing: Statistical Models, Test Plans and Data Analysis*. Wiley-Interscience, 1991

NOTE Référence générale pour les essais accélérés et les méthodes statistiques s'appliquant aux données de dégradation et de défaillance.

[4] ESCOBAR, LA. and MEEKER, WQ. *Statistical Methods for reliability data*. Wiley, 1998.

NOTE Référence générale pour les essais accélérés et les méthodes statistiques s'appliquant aux données de dégradation et de défaillance.

[5] LUVALLE, MJ., COPELAND, LR., KANNAN, S., JUDKINS, JB. and LEMAIRE, PJ. A strategy for extrapolation in accelerated testing. *Bell Labs Technical Journal*, 1998, Vol. 3, No 3, 139-147.

NOTE Cette référence donne un exemple utilisant la cinétique pour concevoir une expérience recherchant les modes de dégradation et de défaillance cachées.

[6] LU, CJ. and MEEKER, WQ. Using degradation measures to estimate a time to failure distribution. *Technometrics*, 1993, **35**, 169-174.

NOTE Cette référence traite de l'utilisation de la dégradation à la place des données de défaillance.

² A l'étude.

Bibliography

The basic concepts on test methods and the analytical tools available for estimating reliability of devices are given in references [3] and [4]. They give descriptions of the integrated physical and statistical modeling that goes into the design and analysis of accelerated tests. Additional information is given in references [5] and [6] on experimental design and data analysis.

[1] IEC 62005-1:2001, *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components – Part 1: Introductory guide and definitions*

[2] IEC 62005-5, *Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components – Part 5: Relating accelerated tests to standardized service environments*²

[3] NELSON, W. *Accelerated Testing: Statistical Models, Test Plans and Data Analysis*. Wiley-Interscience, 1991

NOTE A general reference for accelerated testing and statistical methods for failure and degradation data.

[4] ESCOBAR, LA. and MEEKER, WQ. *Statistical Methods for reliability data*. Wiley, 1998.

NOTE A general reference for accelerated testing and statistical methods for failure and degradation data.

[5] LUVALLE, MJ., COPELAND, LR., KANNAN, S., JUDKINS, JB. and LEMAIRE, PJ. A strategy for extrapolation in accelerated testing. *Bell Labs Technical Journal*, 1998, Vol. 3, No 3, 139-147.

NOTE This reference gives an example using kinetics to design an experiment that explores for hidden degradation or failure modes.

[6] LU, CJ. and MEEKER, WQ. Using degradation measures to estimate a time to failure distribution. *Technometrics*, 1993, **35**, 169-174.

NOTE This reference discusses the use of degradation instead of failure data.

² Under consideration.



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent
- librarian
- researcher
- design engineer
- safety engineer
- testing engineer
- marketing specialist
- other.....

Q3 I work for/in/as a: (tick all that apply)

- manufacturing
- consultant
- government
- test/certification facility
- public utility
- education
- military
- other.....

Q4 This standard will be used for: (tick all that apply)

- general reference
- product research
- product design/development
- specifications
- tenders
- quality assessment
- certification
- technical documentation
- thesis
- manufacturing
- other.....

Q5 This standard meets my needs: (tick one)

- not at all
- nearly
- fairly well
- exactly

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date
- standard is incomplete
- standard is too academic
- standard is too superficial
- title is misleading
- I made the wrong choice
- other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
- (2) below average,
- (3) average,
- (4) above average,
- (5) exceptional,
- (6) not applicable

- timeliness.....
- quality of writing.....
- technical contents.....
- logic of arrangement of contents
- tables, charts, graphs, figures.....
- other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only
- English text only
- both English and French texts

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse



Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat
- bibliothécaire
- chercheur
- ingénieur concepteur
- ingénieur sécurité
- ingénieur d'essais
- spécialiste en marketing
- autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie
- comme consultant
- pour un gouvernement
- pour un organisme d'essais/
certification
- dans un service public
- dans l'enseignement
- comme militaire
- autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence
- une recherche de produit
- une étude/développement de produit
- des spécifications
- des soumissions
- une évaluation de la qualité
- une certification
- une documentation technique
- une thèse
- la fabrication
- autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

- pas du tout
- à peu près
- assez bien
- parfaitement

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée
- la norme est incomplète
- la norme est trop théorique
- la norme est trop superficielle
- le titre est équivoque
- je n'ai pas fait le bon choix
- autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

- publication en temps opportun
- qualité de la rédaction.....
- contenu technique
- disposition logique du contenu
- tableaux, diagrammes, graphiques,
figures
- autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français
- uniquement le texte anglais
- les textes anglais et français

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-7376-2



9 782831 873763

ICS 33.180.20

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND